现代密码学作业——第五讲

1,

状态	<i>‡</i> 会山
小心	输出
1000	0
1100	0
1110	0
1111	1
0111	1
1011	1
0101	1
1010	0
1101	1
0110	0
0011	1
1001	1
0100	0
0010	0
0001	1
1000	0

输出为: 000111101011001

状态	输出
1011	1
1101	1
1110	0
1111	1
0111	1
1011	1

输出: 11011

周期: 5

初始化:

S: 0 1 2 3

K: 1231

KSA:

$$i=0, j=0+s[0]+k[0] \mod 4 = 1, swap(s[0],s[1]) => S: 1 \ 0 \ 2 \ 3$$

$$i=1, j=1+s[1]+k[1] \mod 4 = 3, swap(s[1],s[3]) => S: 1 \ 3 \ 2 \ 0$$

$$i=2, j=2+s[2]+k[2] \mod 4 = 3, swap(s[2],s[3]) => S: 1 \ 3 \ 0 \ 2$$

$$i=3, j=3+s[3]+k[3] \mod 4 = 2, swap(s[3],s[2]) => S: 1 \ 3 \ 2 \ 0$$

PRGA:

$$i=0, j=0$$
:

$$i=(i+1) \mod 4=1$$

$$j=(j+s[i]) \mod 4=3$$

$$swap(s[i],s[j])=swap(s[1],s[3])$$

$$=>S: 1 0 2 3$$

$$t=(s[i]+s[j])=(s[1]+s[3]) \mod 4=3$$

$$k=s[t]=s[3]=3$$

重复上述过程,可得密钥 key:1100110111

5级本原多项式 P(x)=x⁵+x³+1

对应的反馈函数为 b_{i+6}=b_{i+3}⊕b_{i+1}

4 二元序列的检测

4.1 数据格式

待检数据以比特串的形式接受检测。

4.2 显著性水平

本标准确定的显著性水平为 $\alpha=0.01$ 。

4.3 样本长度

本标准中样本长度选取 106 比特。

4.4 检测项目

4.4.1 概述

本标准采用的随机性检测项目共有 15 项,分别为单比特频数检测、块内频数检测、扑克检测、重叠子序列检测、游程总数检测、游程分布检测、块内最大"1"游程检测、二元推导检测、自相关检测、矩阵秩检测、累加和检测、近似熵检测、线性复杂度检测、Maurer 通用统计检测、离散傅立叶检测。附录 A 描述了这 15 种检测项目的原理。

4.4.2 单比特频数检测

- a) 将待检序列 ϵ 中的 0 和 1 分别转换成 -1 和 1, $X_i = 2\epsilon_i 1(1 \le i \le n)$.
- b) 对其累加求和得 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.
- c) 计算统计值 $V = \frac{|S_n|}{\sqrt{n}}$.
- d) 计算 P-value= $erfc(V/\sqrt{2})$ 。
- e) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过单比特频数检测。

4.4.3 块内频数检测

- a) 将待检序列 ε 分成 $N = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ 个长度为 m 的非重叠子序列,将多余的比特舍弃。本规范 $\mathbf{p}_m = 100$.
- b) 计算每个子序列中 1 所占的比例 $\pi_i = \frac{\displaystyle\sum_{j=1}^m \varepsilon_{(i-1)m+j}}{m}$ $, 1 \leqslant i \leqslant N$ 。
- c) 计算统计量 $V = 4m \sum_{i=1}^{N} \left(\pi_i \frac{1}{2}\right)^2$.
- d) 计算 P-value= $igamc(\frac{N}{2}, \frac{V}{2})$ 。

e) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过块内频数检测。

4.4.4 扑克检测

- a) 将待检序列划 ϵ 分成 $N=\left|\frac{n}{m}\right|$ 个长度为 m 的非重叠子序列,将多余的比特舍弃,统计第 i 种子序列模式出现的频数,用 n_i (1 $\leqslant i \leqslant 2^m$) 表示。本规范取 m=4,8。
- b) 计算统计值 $V = \frac{2^m}{N} \sum_{i=1}^{2^m} n_i^2 N$.
- c) 计算 P-value= $igamc((2^m-1)/2, V/2)$ 。
- d) 如果 P-value≥a,则认为待检序列通过扑克检测。

4.4.5 重叠子序列检测

- a) 由待检序列 ϵ 构造一个新的序列 ϵ' ,构造方法如下:将序列 ϵ 最开始的 m-1 位数据添加到序列 ϵ 的结尾即可得到新序列 ϵ' ,新序列 ϵ' 的长度为 n'=n+m-1。本规范取 m=2.5。
- b) 计算 ϵ' 中每一种 m 位子序列模式(共有 2^m 个)出现的频数,记 m 位子序列模式 $i_1i_2\cdots i_m$ 的出现 频数为 $v_{i_1i_2\cdots i_m}$ 。计算每一种 m-1 位子序列模式(共有 2^{m-1} 个)出现的频数,记 m-1 位子序列模式 $i_1i_2\cdots i_{m-1}$ 的出现频数为 $v_{i_1i_2\cdots i_{m-1}}$ 。 计算每一个 m-2 位子序列模式(共有 2^{m-2} 个)出现的频数,记 m-2 位子序列模式 $i_1i_2\cdots i_{m-2}$ 的出现频数为 $v_{i_1i_2\cdots i_{m-2}}$ 。
- c) 计算

$$\begin{split} \Psi_{m}^{2} &= \frac{2^{m}}{n} \sum_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m}} \left(v_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m}} - \frac{n}{2^{m}} \right)^{2} = \frac{2^{m}}{n} \sum_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m}} v_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m}}^{2} - n \\ \\ \Psi_{m-1}^{2} &= \frac{2^{m-1}}{n} \sum_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-1}} \left(v_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-1}} - \frac{n}{2^{m-1}} \right)^{2} = \frac{2^{m-1}}{n} \sum_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-1}} v_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-1}}^{2} - n \\ \\ \Psi_{m-2}^{2} &= \frac{2^{m-2}}{n} \sum_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-2}} \left(v_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-2}} - \frac{n}{2^{m-2}} \right)^{2} = \frac{2^{m-2}}{n} \sum_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-2}} v_{i_{1}i_{2}\cdots i_{m-2}}^{2} - n \end{split}$$

d) 计算

$$\nabla \Psi_{m}^{2} = \Psi_{m}^{2} - \Psi_{m-1}^{2}$$

$$\nabla^{2} \Psi_{m}^{2} = \Psi_{m}^{2} - 2\Psi_{m-1}^{2} + \Psi_{m-2}^{2}$$

- e) 计算 P-valuel= $igamc(2^{m-2}, \nabla \Psi_m^2/2), P$ -value2= $igamc(2^{m-3}, \nabla^2 \Psi_m^2/2), P$
- f) 如果 P-value1≥α且 P-value2≥α,则认为待检序列通过重叠子序列检测。

4.4.6 游程总数检测

- a) 对长度为 n 的待检序列 $\epsilon_1 \epsilon_2 \cdots \epsilon_n$, 计算 $V_n(obs) = \sum_{i=1}^{n-1} r(i) + 1$ 。其中, 当 $\epsilon_i = \epsilon_{i+1}$ 时, r(i) = 0; 否则, r(i) = 1。
- b) 计算序列中 1 的比例 $\pi = \frac{\sum_{i=1}^{n} \epsilon_i}{n}$
- c) $\text{H} \cancel{p} \text{-value} = \operatorname{erfc} \left(\frac{|V_s(obs) 2n\pi(1-\pi)|}{2\sqrt{2n}\pi(1-\pi)} \right).$
- d) 如果 P-value $\geqslant \alpha$,则认为待检序列通过游程总数检测。

4.4.7 游程分布检测

a) 计算 $e_i = (n-i+3)/2^{i+2}$, $1 \le i \le n$, 并求出满足 $e_i \ge 5$ 的最大整数 k。

- b) 统计待检序列 ε 中每一个游程的长度。变量 b_i , g_i 分别记录一个二元序列中长度为 i 的 1 游程和 0 游程的数目。
- c) 计算 $V = \sum_{i=1}^{k} \frac{(b_i e_i)^2}{e_i} + \sum_{i=1}^{k} \frac{(g_i e_i)^2}{e_i}$ 。
- d) 计算 P-value=igamc(k-1,V/2).
- e) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过游程分布检测。

4.4.8 块内最大"1"游程检测

- a) 将待检序列 ϵ 划分成 $N = \left| \frac{n}{m} \right|$ 个长度为 m 的非重叠子序列,含弃多余的位不用。本规范取 m = 10,000
- b) 计算每一个子序列中最大 1 游程的长度,并将其归入相应的集合 $\{v_0,v_1,\cdots,v_s\}$ 。
- c) 计算统计值 $V = \sum_{i=0}^{6} \frac{(v_i N\pi_i)^2}{N\pi_i}$ 。 其中, v_i 和 π_i 的定义见附录 A. 7。
- d) 计算 P-value=igamc(3,V/2)
- e) 如果 P-value≥a,则认为待检序列通过块内最大"1"游程检测。

4.4.9 二元推导检测

- a) 对待检序列 ϵ ,依次将初始序列中相邻两个比特作异或操作得到新序列 ϵ' ,即 $\epsilon'_i = \epsilon_i \oplus \epsilon_{i+1}$ 。
- b) 重复 a)操作 k 次。本规范取 k=3,7。
- c) 将新序列 ε' 中的 0 和 1 分别转换成-1 和 1,然后对其累加求和得 $S_{n-1} = \sum_{i=1}^{n-1} (2\varepsilon'_i 1)$ 。
- d) 计算统计值 $V = \frac{|S_{n-1}|}{\sqrt{n-k}}$.
- e) 计算 P-value=erfc($|V|/\sqrt{2}$)。
- f) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过二元推导检测。

4.4.10 自相关检测

- a) 计算 $A(d) = \sum_{i=0}^{s-d-1} (\epsilon_i \bigoplus \epsilon_{i+d})$ 。 本规范取 d=1,2,8,16。
- b) 计算统计值 $V = \frac{2(A(d) ((n-d)/2))}{\sqrt{n-d}}$.
- c) 计算 P-value= $erfc(|V|/\sqrt{2})$ 。
- d) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过自相关检测。

4.4.11 矩阵秩检测

- a) 将待检序列 ε 分成大小为 M*Q 的子序列,共有 $N=\left\lfloor\frac{n}{MQ}\right\rfloor$ 个,舍弃多余的位不用。将每一个 M*Q 的子序列组装成一个 $M\times Q$ 的矩阵,此矩阵有 M 行 Q 列,每一行则由序列 ε 中连续的 Q 位填充。本规范取 M=Q=32。
- b) 计算每一个矩阵的秩 R_i ($i=1,2,\dots,N$)。
- c) 令 F_M 为秩为 M 的矩阵的个数,令 F_{M-1} 为秩为 M-1 的矩阵的个数,则 $N-F_M-F_{M-1}$ 为秩小于 M-1 的矩阵的个数。
- d) 计算统计值

$$V = \frac{(F_{\rm M} - 0.2888N)^2}{0.2888N} + \frac{(F_{\rm M-1} - 0.5776N)^2}{0.5776N} + \frac{(N - F_{\rm M} - F_{\rm M-1} - 0.1336N)^2}{0.1336N}.$$

- e) 计算 P-value=igamc(1,V/2)。
- f) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过矩阵秩检测。

4.4.12 累加和检测

- a) 将待检序列 ϵ 中的 0 和 1 分别转换为-1 和 $1, X_i = 2\epsilon_i 1 (1 \leq i \leq n)$.
- b) 计算 $S_i = S_{i-1} + X_i$,其中 $S_1 = X_1$, $(1 \le i \le n)$ 。
- c) 计算 $Z = \max_{1 \leq i \leq n} |S_i|$ 。
- d) 计算

$$\begin{split} P\text{-value} = & 1 - \sum_{i=(-(n/z)-1)/4}^{((n/z)-1)/4} \left[\Phi\Big(\frac{(4i+1)z}{\sqrt{n}}\Big) - \Phi\Big(\frac{(4i-1)z}{\sqrt{n}}\Big) \right] \\ & + \sum_{i=(-(n/z)-3)/4}^{((n/z)-1)/4} \left[\Phi\Big(\frac{(4i+3)z}{\sqrt{n}}\Big) - \Phi\Big(\frac{(4i+1)z}{\sqrt{n}}\Big) \right] \end{split}$$

e) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过累加和检测。

4.4.13 近似熵检测

- a) 由待检序列 ϵ 构造一个新的序列 ϵ' ,构造方法如下:将序列 ϵ 最开始的 m-1 位数据添加到序列 ϵ 的结尾即可得到 ϵ' ,新序列 ϵ' 的长度为 n'=n+m-1。本规范取 m=2,5。
- b) 计算 ϵ' 中所有的 2^m 个 m 位子序列模式的出现频数,记 m 位模式 i_1 i_2 \cdots i_m 出现的频数 为 $v_{i_1i_2\cdots i_m}$ 。
- c) 对于所有的 $j(0 \le j \le 2^m 1)$, 计算 $C_j^m = \frac{v_{i_1 i_2 \cdots i_m}}{n}$.

d) 计算
$$\varphi^{(m)} = \sum_{i=0}^{2^m-1} C_i^m \ln C_i^m$$
 。

- e) 用m+1 代替m,重复操作a)至d),计算得到 $\varphi^{(m+1)}$ 。
- f) 计算 $ApEn(m) = \varphi^{(m)} \varphi^{(m+1)}$, 计算统计值 $V = 2n[\ln 2 ApEn(m)]$.
- g) 计算 P-value= $igamc(2^{m-1}, V/2)$ 。
- h) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过近似熵检测。

4.4.14 线性复杂度检测

- a) 将待检序列 ε 划分为 $N = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ 个长度为 m 的非重叠子序列,将多余的比特舍弃。本规范取 m = 500。
- b) 计算每一个子序列的线性复杂度 $L_i(1 \leq i \leq N)$ 。

c) if
$$\mu = \frac{m}{2} + \frac{9 + (-1)^{m+1}}{36} - \frac{1}{2^m} \left(\frac{m}{3} + \frac{2}{9} \right)$$
.

- d) 对每一个子序列,计算 $T_i = (-1)^m (L_i \mu) + 2/9$ 。
- e) 设置 7 个正整数 v_0 , v_1 , \cdots , v_k , 将这 7 个正整数的初值都设为 0。对所有的 $1 \le i \le N$ 有:如果 : $T_i \le -2.5$, v_0 加 1;

$$-2.5 < T_i \le -1.5, v_1$$
加 1;

$$-0.5 < T_i ≤ 0.5, v_3 m 1;$$

1.5< $T_i \le 2.5$, v_5 加 1; $T_i > 2.5$, v_5 加 1。

- f) 计算统计值 $V = \sum_{i=0}^{6} \frac{(v_i N\pi_i)^2}{N\pi_i}$ 。 其中, π_i 的值见附录 A. 13。
- g) 计算 P-value=igamc(3,V/2)。
- h) 如果 P-value≥a,则认为待检序列通过线性复杂度检测。

4. 4. 15 Maurer 通用统计检测

- a) 将待检序列 ε 分成两部分:初始序列和测试序列。初始序列包括 $Q \wedge L$ 位的非重叠的子序列,测试序列包括 $K \wedge L$ 位的非重叠的子序列,将多余的位(不够组成一个完整的 L 位子序列)舍弃,K=[n/L]-Q。本规范取 L=7,Q=1 280。
- b) 针对初始序列,创建一个表,它以 L 位值作为表中的索引值, T_j ($1 \le j \le 2^L$)表示表中第 j 个元素的值,计算 $T_j = i(1 \le i \le Q)$,其中 j 是初始序列中第 i 个L 位子序列的十进制表示。
- c) 计算 $sum = \sum_{i=Q+1}^{Q+K} \log_2(i-T_i)$,其中,遍历完第 $i(Q+1 \leqslant i \leqslant Q+K)$ 个 L 位子序列后,应更新 $T_j = i$ 。
- d) 计算 $V = \frac{sum}{K} E(L)$ σ , E(L) 和 σ 的计算见附录 A. 14。
- e) 计算 P-value= $erfc(|V|/\sqrt{2})$ 。
- f) 如果 P-value≥a,则认为待检序列通过通用统计检测。

4.4.16 离散傅立叶检测

- a) 将待检序列 ϵ 中的 0 和 1 分别转换成 -1 和 1,得到新序列 X_1, X_2, \dots, X_s $(X_i = 2\epsilon_i 1)$ 。
- b) 对新序列进行傅立叶变换,得到一系列的复数 f_1, f_2, \dots, f_n 。
- c) 对每一个 f_i , 计算其系数 $mod_i = modulus(f_i) = |f_i|$, 这里 $i \in [0, n/2-1]$.
- d) 计算门限值 $T=\sqrt{2.995732274n}$ 。
- e) 计算 $N_0 = 0.95 * n/2$ 。
- f) 计算系数 f_i 小于门限值 T 的复数个数,记作 N_1 。
- g) 计算统计值 $V = (N_1 N_0)/\sqrt{0.95 * 0.05 * n/4}$ 。
- h) 计算 P-value= $erfc(|V|/\sqrt{2})$ 。
- i) 如果 P-value≥α,则认为待检序列通过离散傅立叶检测。

4.5 结果分析

每一个检测项目对应的具体结果分析参见附录 C。

5 随机数发生器的检测

5.1 采样

本规范建议样本数量为1000。

在采样过程中,应将随机数发生器产生的样本数据转换为等价的二元序列。

5.2 存储

将采集的样本按照样本长度要求,逐一存储为二进制文件。

二进制文件宜按照日期和流水号相结合的方式命名,以表明数据采集的时间和先后顺序。全部二进制文件宜存放在统一的文件目录下,且文件目录的名称应能明示样本的来源(如随机数发生器的名称、编号、采集人等)信息。

5.3 检测

对每一个样本按第 4 章描述的检测方法进行检测,分别得到每一个随机性检测项目的 P-value 值,记录这些结果。

5.4 判定

对于每一个随机性检测项目,统计 P-value 值不小于显著性水平 α (表示该样本通过该项检测)的样本个数。记样本数量为 s,则通过检测的样本个数应不小于 $s\left(1-a-3\sqrt{\frac{a(1-a)}{s}}\right)$ 。当样本数量为 1 000个时,如果通过的样本个数不小于 981,则随机数发生器通过此项检测;否则,未通过此项检测。

如果随机数发生器通过本规范规定的所有检测项目,则随机数发生器通过本规范检测;否则,未通过本规范检测。

对于使用随机数发生器的各种装置或设备,其随机性检测可参照本规范。